

2025年2月13日

各位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社
代表者 董事长 山崎 秀和
所在地 京都府向日市森本町东之口 1-1
NidecParkC 栋

关于尼得科精密检测科技参展 SEMICON KOREA 2025

尼得科精密检测科技株式会社将参加 2025 年 2 月 19 日（周三）至 2 月 21 日（周五）于首尔市 COEX 会议中心举办的“SEMICON KOREA 2025”。



本次展会上，尼得科精密检测科技将展出用于 IGBT/SiC 的功率半导体检测设备、用于 EV/HEV 等驱动电机的测试台以及尼得科精密检测科技的子公司 SV Probe 开发制造的晶圆检测治具“探针卡”等最新解决方案。

本次参展将主要介绍体现公司核心“测量”技术的半导体探针卡、半导体封装基板电气检测系统“GATS 系列”以及功率半导体电气检测系统“NATS 系列”产品。

基于长期积累的检测技术，尼得科精密检测科技将为客户提供最新的检测解决方案以及贡献于未来的新产品和新技术。

〈参展概要〉

- 展 期：2025 年 2 月 19 日(周三)~2 月 21 日(周五)
- 会 场：首尔市 COEX 会议中心
- 展 位：3 楼 HallC C600
- 官 网：<https://www.semiconkorea.org/en>

〈参展产品〉

- 用于高电压测试的加压结构探针卡
- 用于高温/高电流测试的探针卡
- 2D-MEMS 探针卡
- 用于 IGBT/SiC 模块的绝缘/静态特性/动态特性检测装置“NATS-1000/1700 系列”
- KGD 测试设备“NATS-1300 系列”
- 用于功率半导体模块的动态可靠性测试设备“NATS-8000 系列”
- Reference Inverter
- 用于 EV 驱动电机的测试台“TDAS 系列”
- 半导体封装基板电气检测系统“GATS-7000 系列”
- AI 服务器大型基板电气检测系统“GATS-8360”
- AC/DC 多功能测试仪“R-700 系列”
- 超高精度检测用探针